

## Лаборатория Неорганической Кристаллохимии Кафедра Неорганической Химии, Химический Факультет МГУ

Качественный рентгенофазовый анализ. Базы данных ICDD+COD.

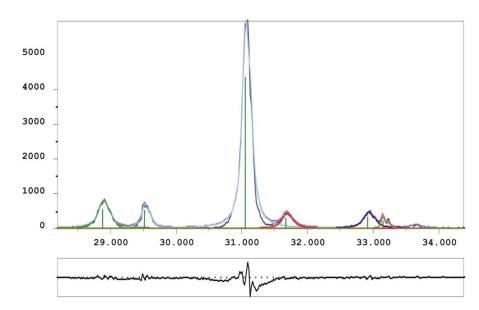
# Наши планы 2025

Тип	Nº	Тема	Дата
Лекция		9Качественный РФА	06.10.2024
Лекция	1	0Индицирование дифрактограмм	08.10.2024
		Профильный анализ и	
Практикум		<b>1</b> индицирование	13.10.2024
Лекция	1	1Решение структур	15.10.2024
Лекция	1	2Метод Ритвельда	20.10.2024
		Дифракция на несовершенных	
Лекция	1	3 <mark>кристаллах</mark>	22.10.2024
Практикум		<b>2</b> Анализ методом ЛеБеля + решение	27.10.2024
Практикум		ЗУточнение структуры	29.10.2024
Лекция	1	4Количественный РФА	03.11.2024
Контрольная		<b>2</b> Вторая часть курса	05.11.2024

# Содержание

- 1. Качественный РФА.
- 2. Базы данных ICDD+COD
- 3. Некоторые практические аспекты

# 0.1 Профильный анализ - результаты



## Профильный анализ:

$$I_{theor}(2\theta) = B(\theta) + \sum_{i} P_{i}(2\theta_{i}, I_{i}, H_{i}, 2\theta)$$

## Наилучшая оценка качества уточнения

- по виду разностной дифрактограммы!

#### Критерии качества

$$R_{P} = \frac{\sum_{i} \left| I_{meop} - I_{_{\mathfrak{I}KCN}} \right|}{\sum_{i} I_{_{\mathfrak{I}KCN}}}$$

$$R_{wP} = \left[\frac{\sum_{i} w_{i} (I_{meop} - I_{\mathfrak{K}Cn})^{2}}{\sum_{i} w_{i} (I_{\mathfrak{K}Cn})^{2}}\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\chi^{2} = \frac{\sum_{i} w_{i} \left(I_{meop} - I_{skcn}\right)^{2}}{n - p}$$

(n - число точек, p - число уточняемых параметров)

Для качественной рентгенограммы  $R_{\rm P} \sim 1-3~\%,~\chi^2=0.8-2$ 

# 0.1 Профильный анализ - результаты

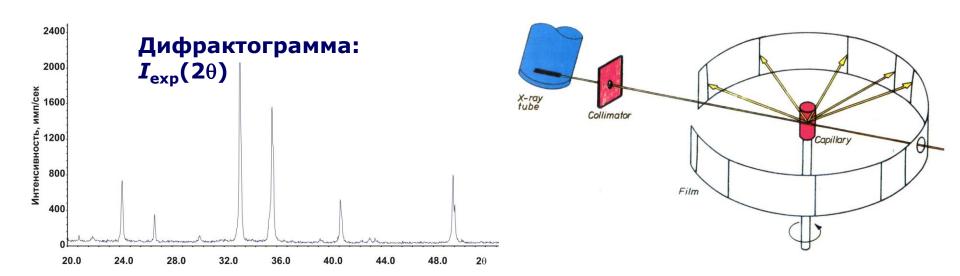
## Результат профильного анализа (файл \*.pft в WinXPow)

!	D	2Theta	I(rel)	I(abs)	I(int)	FWHM	Н	K	L	
14.	248472	6.1981	3.04	33	7.68	0.1781	0	1	0	
9.	814859	9.0027	6.16	66	14.78	0.1694	1	0	0	
9.	587812	9.2164	2.66	28	6.36	0.1688	1	1	0	
7.	140107	12.3866	4.38	47	9.89	0.1596	-1	1	0	М
5.	121028	17.3024	24.07	258	50.16	0.1472	-1	-1	1	
4.	758203	18.6331	25.94	278	52.98	0.1443	0	1	1	
3.	736961	23.7913	68.18	729	130.34	0.1350	0	-3	1	

- 1. Межплоскостное расстояние
- 2. Угол 20
- 3. Относительная интенсивность (%)
- 4. Абсолютная интенсивность (в максимуме, за вычетом фона)
- 5. Интегральная интенсивность
- 6. Полуширина
- 7. Индексы *h,k,l* после индицирования ©

## 1. Физические основы РФА.

- 1. Дифракция рентгеновского излучения (РИ) когерентное упругое рассеяние РИ с интерференцией вторичных волн.
- 2. Амплитуда дифрагировавшего РИ пропорциональна Фурье-компоненте электронной плотности.
- 3. Для периодической системы монокристалла Фурье образ состоит из узких максимумов.
- 4. Для порошка 1D проекция 3D картины.



## 1. Физические основы РФА.

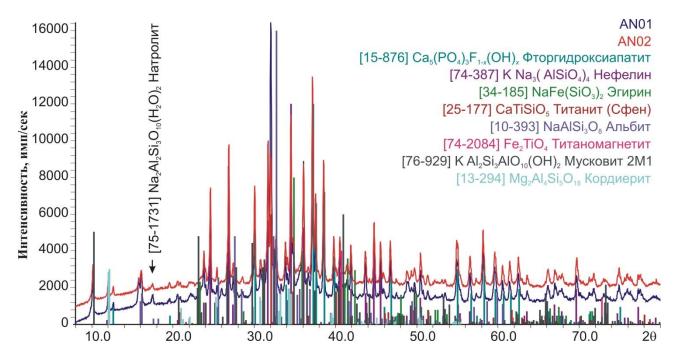
- 1. Распределение  $\rho(r)$  уникально для каждого соединения.
- 2.  $\rho$ (r) ↔ расположение атомов
- 2. От периодичности  $\rho(r)$  (параметров ячейки кристалла) зависит положение максимумов.
- 3. От вида функции  $\rho(r)$  (распределения атомов) внутри ячейки зависит интенсивность максимумов.
- 4. Ключ к РФА интенсивность и положения максимумов. Определить их можно с использованием профильного анализа.

$$2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda$$

!	D	2Theta	I(rel)	I (abs)	I(int)	FWHM	H	K	L	
1	4.248472	6.1981	3.04	33	7.68	0.1781	0	1	0	
!	9.814859	9.0027	6.16	66	14.78	0.1694	1	0	0	
!	9.587812	9.2164	2.66	28	6.36	0.1688	1	1	0	
•	7.140107	12.3866	4.38	47	9.89	0.1596	-1	1	0	M
!	5.121028	17.3024	24.07	258	50.16	0.1472	-1	-1	1	
	4.758203	18.6331	25.94	278	52.98	0.1443	0	1	1	
:	3.736961	23.7913	68.18	729	130.34	0.1350	0	-3	1	

## 1. Физические основы РФА.

- 1. Дифрактограмма = «отпечаток пальца» кристаллической фазы.
- 2. Дифрактограмма смеси фаз = суперпозиция дифрактограмм отдельных фаз.
- 3. Относительные интенсивности максимумов от разных фаз связаны с содержанием фаз в смеси ключ к количественному РФА.
- 4. Как по виду дифрактограммы определить, что за фазы присутствуют в смеси? Сравнение с дифрактограммами стандартов.



# A comprehensive database of powder diffraction patterns – ICDD PDF

(see: www.icdd.com)



#### Release 2005

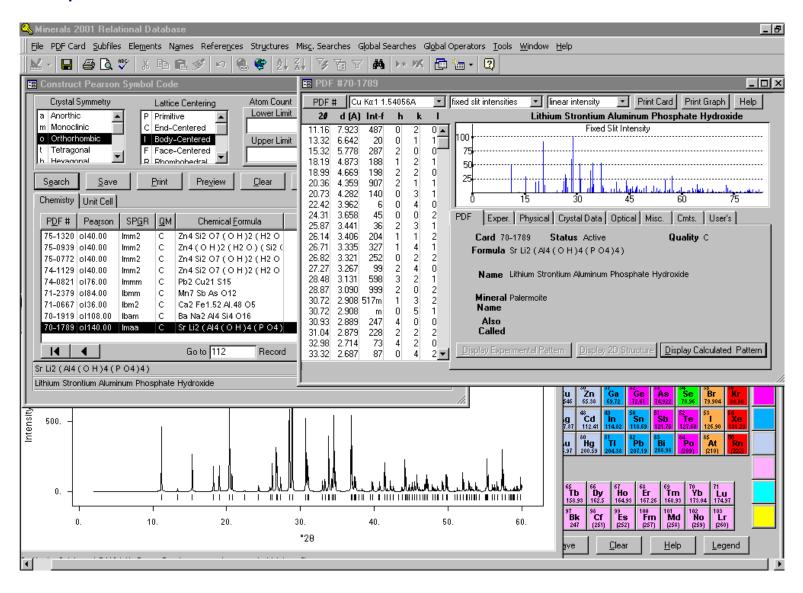
	PDF-2	PDF-4+	PDF-4	PDF-4
<b>Entry Source</b>		(	Minerals)	(Organics)
Experimental	96,493	96,493	9,083	26,792
FIZ	68,404	59,223	7,507	1,202
CCDC	0	0	0	237,200
NIST	9,802	5,565	70	14
MPDS	0	78,769	1,166	0
Total No. of Data sets	174,699	240,050	17,826	265,208

#### (International Centre for Diffraction Dat

# БД PDF-2

- Постоянно редактируется, дополняется и обновляется
- Каждый год добавляется 2,500 экспериментальных и несколько тысяч расчетных рентгенограмм. Компьютерный поиск начиная с 1985 г.
- Содержит рентгенограммы чистых фаз
- Выпуск 2013г. содержит ~ 300,000 активных рентгенограмм
- Сейчас доступна в двух форматах:
  - DVD-ROM диск (основной формат)
  - Книги (Sets 1-51 только
     экспериментальные рентгенограммы)

#### Новая версия базы данных - ICDD PDF-4



Каждому стандарту присваивается уникальный номер: XX-YYY-ZZZZ (шкаф – ящик – номер).



#### 44-258

CLCD	d, <b>0</b>	Int.	hkl	d, <b>0</b>	Int.	hkl
SbSBr	6.296	26	110	1.9829	22	002
	4.876	3	020	1.8970	5	150,420
Antimony Bromide Sulfide	<b>4.195</b> 4.119	27 9	120 200	1.8902 1.8540	2 13	112 241,331
	3.794	16	210	1.8340	<1	401
Rad. CuKa <sub>1</sub> λ 1.54056 Filter Mono. d-sp Diff.	3.7 94	10	210	1.0272	<b>\1</b>	401
Cut off 14.7 Int. Diffractometer I/I <sub>cor.</sub> 3.02	3.673	6	011	1.7955	12	411
<b>Ref.</b> Antipov, E., Putilin, S., Shpanchenko, R., Moscow State	3.354	4	111	1.7616	5	250
University, Moscow, Russia. ICDD Grant-in-Aid. (1993)	3.145	9	220	1.7115	<1	151
Sys. Orthorhombic S.G. Pnam(62)	3.023	1	130	1.6774	1	222
<b>a</b> 8.2370(5) <b>b</b> 9.7491(6) <b>c</b> 3.9646(3) <b>A</b> 0.8449 <b>C</b> 0.4067	2.8818	100	121	1.6562	3	431
$\alpha$ $\beta$ $\gamma$ $\mathbf{Z} 4$ <b>mp</b> 330 $d$						0 -0 -10
<b>Ref.</b> Ibid	2.8550	15	201	1.6246	2 3	060,510
	2.7413	12	211 310	1.5935	3 4	160,431
$\mathbf{D_x} = 4.876$ $\mathbf{D_m}$ SS/FOM $F_{30} = 158(.005,36)$	2.6430 2.5507	16 3	230	1.5860 1.5730	4	312 440
Color Orange	2.5136	16	031	1.5656	<1	232
Pattern taken at 26 C. The sample was provided by Shevelkov, A.,	2.3130	10	031	1.5050	\1	232
Dikarev, E., Moscow State University, Moscow, Russia. CAS#:	2.4641	4	221	1.5380	3	042
14794-85-5. Prepared by heating of stoichiometric mixture of Sb, S	2.4369	7	040	1.5266	3	322
and SbBr <sub>3</sub> in sealed silica tube at 360 C for 10 hours followed by an-	2.4037	12	131	1.5116	1	142,260
nealing at 310 C for 6 days. SbSBr melts with decomposition. Single	2.3919	9	320	1.4762	<1	351
crystal cell: a=8.212, b=9.720, c=3.963, S.G.=Pnam, Z=4, [Inushima, T. Habinelaura, K. Jan. J. Appl. Phys. 34,600 (1985)]. Silicon used	2.3366	2	140	1.4692	2	530
T., Uchinokura, K., <i>Jpn. J. Appl. Phys.</i> , <b>24</b> 600 (1985)]. Silicon used as external standard. PSC: oP12.	2.1002	_	011	1 1100	2	2 42 222
as Catalial standard. I SC. 01 12.	2.1992	3	311	1.4408	2	242,332
	2.0972 2.0594	8	330 400	1.4124 1.3986	<1 <1	261 360
	2.0394	1 1	321	1.3779	1	531
	2.0477	5	141	1.3713	$\overset{1}{2}$	152
See follwing card.	2.0131		1-71	1.5/15	_	132

#### Формат «карточки» (записи о стандарте) PDF-2 в WinXPow.

```
[81-1286]
             PDF-2 Sets 1-99
                                 Quality: C
                                                         Wavelength: 1.540598
Lead Vanadium Oxide Phosphate
Pb3 ( P V 08 )
Rad.: CuKa1 (1.54060)
                           Filter:
                                                        d-sp: calculated
I/Icor.:8.52
                           Cutoff: 17.7
                                                        Int.: calculated
Ref.: Calculated from ICSD using POWD-12++, (1997)
                                                          V(redu): 187.6
Sys.: Rhombohedral
                       S.G.: R-3m (166)
a: 5.64410(20)
                                  c: 20.40310(60)
                                                    C: 3.6149
                 b:
A:
                 B:
                                  C:
                                                    z: 3
                                                               mp:
    7.357
                                 SS/FOM: F30= 999.9 ( .0001, 33)
Dx:
                Dm:
ICSD: 072664
Ref.: Kiat, J.- M., Garnier, P., Calvarin, G., Pinot, M., J. Solid State Chem.,
       103, (1993), 490
                                              Sign:
                                                         2V:
               nwB:
ea:
                               ey:
REM
         TEM 300. // REM
                              RVP.
Hanawalt: 3.13/X 2.82/8 4.75/3 3.53/3 2.10/3 1.68/2 1.88/1 2.20/1 1.77/1 1.63/1
Max-d:
          6.80/1 4.75/3 4.41/1 3.53/3 3.40/1 3.13/X 2.82/8 2.61/1 2.50/1 2.43/1
                            h k 1
                                             d[A]
                                                                      h k 1
   d[A]
           2Theta Int.
                                                     2Theta
                                                             Int.
  6.8010
           13.007
                            0 0 3
                                                     68.986
                                                                      0 0 15
                    10
                                            1.3602
                                                               6
  4.7534
           18.652
                   326
                              0 1
                                                                      1 3 1
                            1
                                            1.3527
                                                     69.425
```

## «Подбазы» БД PDF-2 (на примере ящиков 42 и 50).

Sub-File	Entries	Sub-File	Entries
Inorganic	43.308	Zeolites	626
Organic	16.539	Explosives	149
Metals and Alloys	11.630	Polymers	248
Minerals	3.954	Cement	360
Forensic Materials	3.612	Superconductors	139
Common Phases	3.202		
As of Set 42			

Sub-File	Entries	Sub-File	Entries
Inorganic	109.864	Zeolites	1.654
Organic	23.466	Explosives	190
Metals and Alloys	26.921	Polymers	608
Minerals	14567	Cement	392
Forensic Materials	3.722	Superconductors	2579
Common Phases	3.802		
As of Set 50		All w/excl	118.642

## Данные от качестве дифракционного стандарта

#### Знак "\*".

- 1. Химически охарактеризован.
- 2. Интенсивности измерены инструментально.
- 3. Хороший диапазон и сглаженный разброс интенсивностей
- 4. Линии с *d*≤2.50Å : 2.222Å. *d*≤1.200Å : 1.1111Å.
- 5. Нет серьезных систематических ошибок.
- 6. Нет линий с | ∆2θ | ≥0.05°.
- 7. Средняя величина  $|\Delta 2\theta|$  ≤0.03°.
- 8. Нет неиндицированных, примесных линий или линий, не соответствующих погасаниям.

#### Знак "І".

- 1. 1-3,6 выполняются менее жестко.
- 2. Линии с *d*≤2.00Å : 1.111Å.
- 3. Нет линий с | ∆2θ | ≥0.2°.
- Средняя величина |∆2θ|≤0.06°.
- 5. Неиндицированных, примесных линий или линий, соответствующих погасаниям ≤2, среди них нет сильнейших.

## Данные от качестве дифракционного стандарта

#### Знак "О".

- 1. 1-4 могут частично не выполняться.
- 2. Неиндицированых, примесных линий или линий, не соответствующих погасаниям >3.
  - 3. Одна из 3-х сильнейших линий непроиндицирована.

#### Отсутствие знака (В)

1. Не выполняются критерии \*, i, O.

#### <u>Знак "С"</u>.

2. Рентгенограмма рассчитана из структурных данных

Название	Содержание	Центр
Cambridge Structural Database (CSD)	Organic, Organo-metallic	Cambridge UK
Inorganic Crystal Structure Database (ICSD)	Inorganic Materials	Karlsruhe FRG
NRCC Metals Data File (CRYSTMET)	Metals and Alloys	Ottawa Canada
Protein Data Bank (PDB)	Biological Macromolecules	Brookhaven USA
NBS Crystal Data NBS (CD)	Inorganic and Organic	Gaithersburg USA

# 2.1 База данных COD.



DOI

https://www.crystallography.net

Методы поиска соответствия «эксперимент – стандарт» - Search/Match

**SQL** 



Исходные данные:  $\{d,I\}$  Параметры поиска:

- 1.  $|\Delta 2\theta|_{max}$
- 2. Минимальная  $I_{\mathrm{exp}}$
- 3. Минимальное число линий соответствия
- 4. Максимальное число пропущенных линий
- 5. ...

Возможно введение дополнительных ограничений: подбаза, качество...



Исходные данные: *Input* Параметры поиска:

- 1. Сильнейшие линии (3) <u>Hanawalt.</u>
- Линии при малых углах (8 первых) - <u>Fink</u>
- 3. Элементный состав фазы
- 4. Формула, название, минерал, цвет...
- 5. Симметрия, параметры ячейки...
- 6. ...

Критерии качества для автоматического поиска.

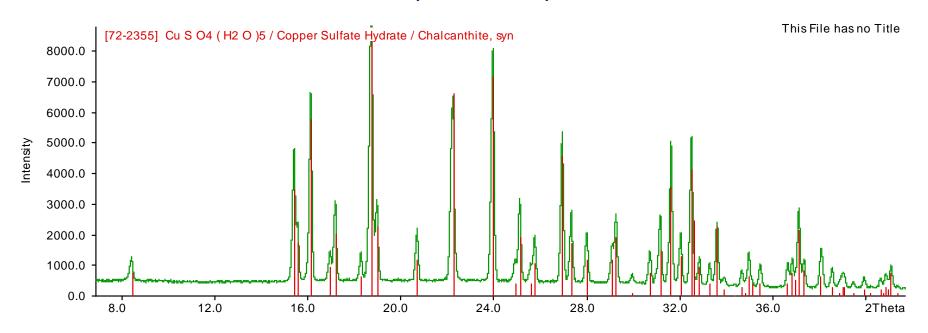
$$F_{\theta} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} \left| \theta_{i}^{std} - \theta_{i}^{exp} \right|}{n_{coinc} \Delta \theta}$$

где *n* - общее число линий на рентгенограмме; std - для стандарта ехр - для наблюдаемой линии

Аналогичный критерий можно ввести и для интенсивностей...

После автоматического поиска результаты по умолчанию упорядочены по  $F(\theta)$ , после ручного – по номеру стандарта

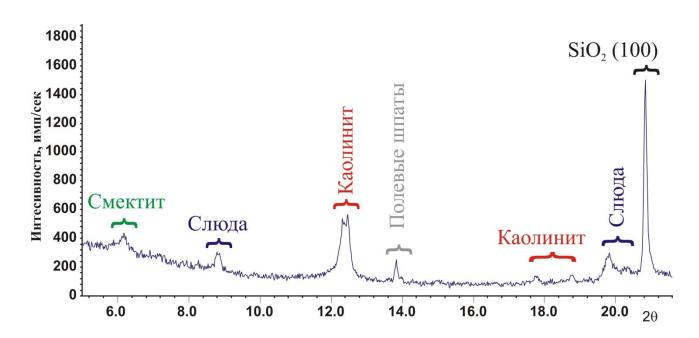
## Финальная стадия поиска – визуальный анализ соответствия «стандарт – эксперимент»



#### Критерии соответствия:

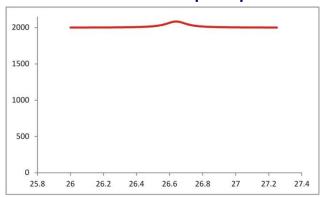
- 1. Все линии стандарта должны присутствовать на экспериментальной дифрактограмме
- 2. Соотношение интенсивностей?
- 3. Качество стандарта \*, I, C
- 4. Химический состав «образец/стандарт»

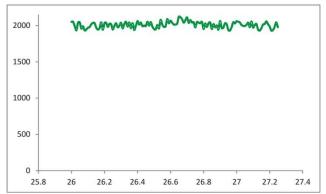
Анализ микропримесей: иногда наблюдается 1-2 рефлекса.

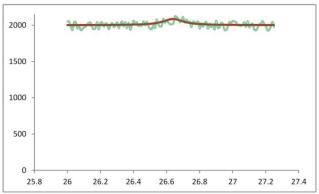


- Многие рефлексы не видны точная идентификация затруднена!
- Легко перепутать с рефлексами от основных фаз.
- Ситуация крайне усложняется при перекрывании рефлексов.
- Будьте особенно аккуратны при определении микропримесей.

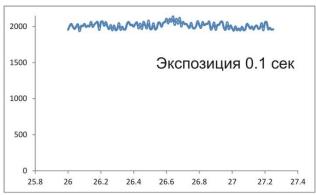
#### Анализ микропримесей: малые интенсивности сигнала

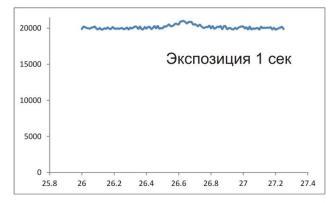


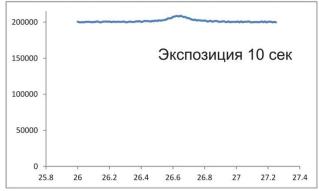




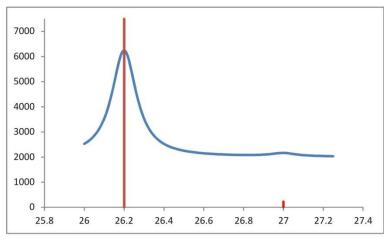
Съемка лучшего качества для анализа микропримесей!

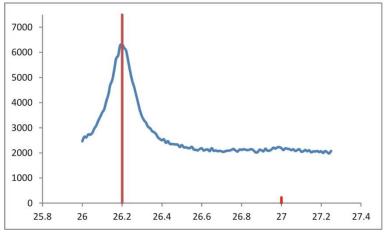




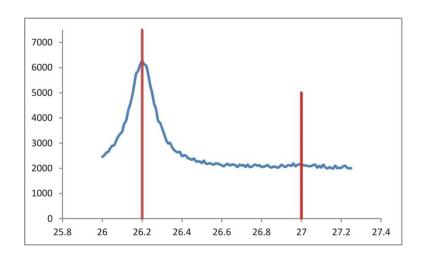


Данные не противоречат присутствию примеси



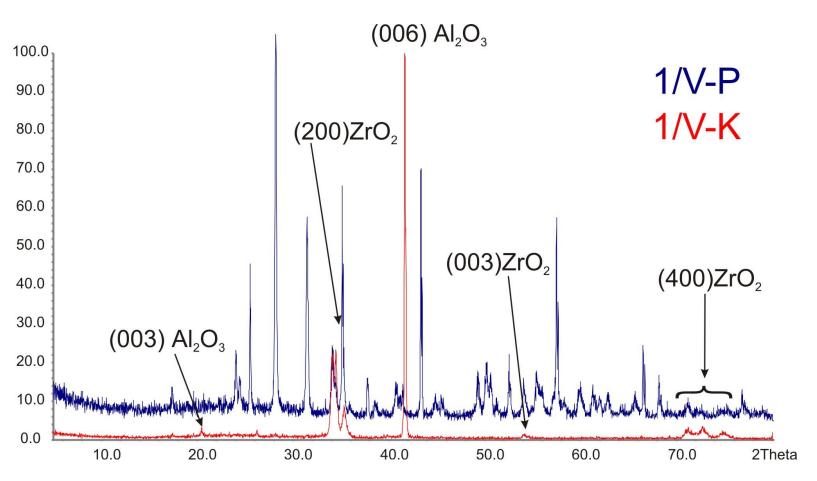


Примесь, вероятно, отсутствует



Помните про использование всей информации об образце!

Текстура – нарушение случайной ориентации кристаллитов в поликристаллической пробе.



Скол и порошок  $ZrO_2/Al_2O_3/SiO_2$  композита